



Liquid Argon Refractive Index

Bianca Bottino, Alice Campani, Ruggero Caravita, Simone Copello, Federico Ferraro

1 marzo 2023

LArRI

Obiettivo principale: Misura diretta dell'indice di rifrazione dell'Argon liquido a lunghezze d'onda prossime a 178 nm (Xe).

Obiettivi Secondari:

- misura a varie lunghezze d'onda (relazione di dispersione)
- misura della lunghezza di attenuazione
- misure ottiche con altri gas nobili liquefatti

Progetto finalizzato allo sviluppo di sistemi ottici, in particolare lenti, per imaging in LAr drogato con Xe.

Strategia di misura

L'idea è misurare l'indice di rifrazione dell'argon liquido confrontando le figure di interferenza prodotte usando un reticolo di diffrazione, facendo propagare la luce in argon e in vuoto.

Immergendo il reticolo in LAr si ottiene che la posizione dei massimi di interferenza dipende da $\lambda_1 = \lambda_0/n$.

Massimi in vuoto: d sin $\theta_0 = \lambda_0$ Massimi in LAr:

 $d \sin \theta_1 = \lambda_1$

 \rightarrow Serve luce coerente e monocromatica





Strategia di misura



Il pattern viene registrato eseguendo una **scansione** lungo un determinato asse **con un** "**singolo**" **SiPM**.

La luce, coerente e monocromatica, proviene dall'esterno del criostato, entrando dall'alto.

Per compattare l'apparato (adattandolo al criostato) non eseguiamo la scansione sul lato opposto al reticolo ma sul fianco.



Schema concettuale

Gli elementi costitutivi dell'apparato sperimentale sono:

- Sorgente di luce: lampada a mercurio con emissione a 185 nm.
- **Sistema ottico** necessario per rendere il fronte d'onda coerente.
- **Reticolo di diffrazione** depositato sulla finestra (trasparente a luce VUV) che separa in sistema ottico dalla camera ottica.
- **SiPM** montati su un **sistema di movimentazione** per eseguire la scansione del pattern.
- **Camera ottica** contenente il reticolo e i SiPM. A seconda della configurazione potrá essere mantenuta in vuoto o riempita di LAr.

80 cm

120 c

Sistema ottico



Camera - primi test di allineamento



Visuale interna della camera con il motore installato, il supporto per i SiPM e 3 Pt100 per monitorare temperatura e livello del liquido.

<u>Ottenuto un buon allineamento assiale</u> con il laser a 403 nm laser e un singolo SiPM montato sul supporto centrale.



SiPM integrated signal (luminosity) during support movement (40 cm): signal is constant within ~30% and reproducible in the two directions.

Elettronica e acquisizione

SiPM

- I segnali provenienti dai SiPM sono integrati (tau ~= 100 ms) e amplificati dalle schede di FE
- Il segnale cosí ottenuto é acquisito con l'oscilloscopio con finestre di 20 ms
- Il valore medio di tensione su tutta la finestra rappresenta un sample della traccia che salviamo



Un'altra traccia ci permette di ricostruire quando é stato mosso il motore (e quindi la posizione dei sensori)

Analisi - prima parte

Riguarda una singola scansione (quindi con una specifica lunghezza d'onda e mezzo di propagazione). Ha lo scopo di individuare la posizione dei massimi di interferenza M1 e M2, partendo dai tracciati dei singoli SiPM e sapendo posizione e tempo di partenza e di arrivo del motore.



Analisi - seconda parte

Le posizioni ricavate da due scansioni distinte (quindi con due mezzi di propagazione) vengono combinate in un fit simultaneo per ricavare l'indice di rifrazione.

- Parametri liberi del modello:
 - 1. z₀ posizione iniziale della lunetta (supporto)
 - 2. θ_s angolo tra lunetta e movimento, meno 90 deg (ovvero varrá ~0 gradi)
 - x₀ offset nella posizione della lunetta lungo l'asse x (ortog. al movimento) (varrá ~0)
 - 4. *a_{reticolo}* passo reticolare a freddo
 - 5. n
- Delle 16 posizioni z solo 8 sono sensibili a n. Gli altri 4 parametri invece incidono si tutte le 16 z



Per la ricerca di <u>effetti sistematici</u> possono essere utilizzati dati provenienti da due scansioni entrambe in vuoto ma realizzate con lunghezze d'onda diverse fra loro, <u>l'indice di rifrazione ottenuto deve coincidere col rapporto delle lambda considerate</u> (vedi prossima slide)

Misure preliminari: in vuoto a T ambiente

Target R.I. = 402.9/253.65 = 1.5884



Possiamo fingere che la variazione di lunghezza d'onda sia dovuta all'introduzione di un indice di rifrazione, per definizione uguale al rapporto tra le lunghezze d'onda considerate.

$$z_{exp} = rac{(x_i+x_0)\cos heta_s}{ an rcsin rac{m\lambda}{an}} - (x_i+x_0)\sin heta_s - z_0$$

Le reali lunghezza d'onda sono:

184,9 nm (misurato con spettrometro Avantes) 253,6 nm (misurato con spettrometro Avantes) 402,9 nm (caratterizzazione di Thorlabs)

Conclusioni

- Hardware montato e testato. Sistema funzionante sia in vuoto a freddo, sia in liquido (azoto);
- Struttura analisi pronta e funzionante, testata su run fatti con laser e riga a 253 nm;
- Acquisiti i primi run con riga a 185 nm.

Prossimi passi:

- Migliorare la qualità dei dati a 185 nm
- Prendere run in LAr per fare la reale misura

Backup slides

In letteratura

1. <u>Optical Properties of Liquid Noble Gas Scintillators</u>, Alexander Maximilian Neumeier (Munich, Tech. U.), 2015

 \Rightarrow **n** estrapolato da misure relative alla fase gassosa

2. Index of refraction, Rayleigh scattering length, and Sellmeier coefficients in solid and liquid argon and xenon, E. Grace et al., NIM A 867 (2017) 204-208

⇒ Estrapolazioni da lunghezze d'onda maggiori: **n**=1,45

- 3. Light propagation in liquid argon, M. Babicz et al 2020 JINST 15 P09009
 - ⇒ Derivato dalla velocitá di gruppo: **n**=1,36

Sorgente di luce

La scelta della lampada e' guidata dai seguenti requisiti o fattori:

- Picco (vicino) a 178 nm
- Lunghezza di coerenza (picco stretto)
- Emettenza (ovvero anche dimensioni della sorgente e collimazione)

La **lunghezza di coerenza** é la massima distanza longitudinale tra due punti aventi fase correlata. La minima richiesta é data da:

 $L = N m \lambda = 1000 \cdot 2 \cdot 190 nm = 380 \mu m$

con **N** numero di fenditure del reticolo, **m** massimo ordine di interferenza che si intende osservare.

L'ipotesi piú promettente sembra quella della lampade a mercurio a bassa pressione

Presentano picchi a 185 e 254 nm (rapporto di potenza 1:5 circa)



Sistema ottico

Serve a dare alla luce una maggiore coerenza spaziale:



Massima distanza <u>trasversa</u> tra due punti aventi fase correlata

Il modo piú semplice é utilizzare un pinhole seguito da uno specchio parabolico.

Dal principio di Heisenberg, fissata la distanza D_s (focale dello specchio), deduciamo la dimensione del pinhole

$$d_p\theta = d_p \frac{d_s}{2D_s} < \frac{\lambda}{2\pi}$$

Per esempio: $\lambda = 170 \text{ nm}$ $D_s = 60 \text{ mm}$ $d_s = 2 \text{ mm}$ $d_p = 2 \mu \text{m}$

Flusso atteso oltre il reticolo: $10^2 - 10^4$ fotoni/s

Stiamo lavorando a una pubblicazione che riassuma i risultati ottenuti con il sistema ottico!

Studio preliminare (ottica)



Nella prima fase ci siamo concentrati sullo studio della sorgente:

- > Spettro della sorgente e larghezza del picco @ 184.9 nm (\rightarrow coerenza temporale)
- Stabilitá nel tempo
- Lunghezza di assorbimento in aria

e del <u>sistema ottico</u>:

- Flusso ottenuto
- Livello di coerenza







120 cr

80 cm

25 cm

Camera ottica

La rivelazione dei massimi della figura di interferenza avviene sulle pareti verticali della camera.

Questo design consente eventualmente di minimizzare la camera e di poter sfruttare la profondità di criostati già a disposizione.

I 2 SiPM (uno per lato) sono montati su un supporto in grado di muoversi lungo la verticale per eseguire la scansione con una precisione di almeno 100 µm.







SiPM Hamamatsu

Hamamatsu S13370-3075CN (9 mm²) DCR: <1 Hz/mm² @ 165 K <25 mHz/mm² @ 77K (S13360-DUNE) PDE: 24% @ 178 nm (nominale)

PDE measurement data

<\$13370-3050CN / \$13370-3075CN>





Fondi da scintillazione

Per una camera di raggio 10 cm, alta 30-90 cm, i fondi aspettati sono

- raggi cosmici \Rightarrow ~ 5-15 s⁻¹ in 50-150 MeV
- $^{39}Ar \implies ~ ~ 10-30 \text{ s}^{-1} \text{ in } 0-565 \text{ keV}$

Soluzione: piú SiPM in anti-coincidenza.

Simulazioni

Figura di interferenza generata, su un solo binario, nel caso di misura in vuoto e in LAr



Viene utilizzata solo la parte contenente i primi due massimi (m=1,2). Fit simultaneo di entrambe le configurazioni mediante il cambio di variabile: $x \Rightarrow x' = R \operatorname{Cotan}(\operatorname{Sin}^{-1}(n \operatorname{Sin}(\operatorname{Cotan}^{-1}(x/R))))$

Valore di n ricostruito con errore relativo dell'ordine di **10**⁻⁴.

Segnali 184.9 nm

